

电气电子产品检验，盐雾测试实验

产品名称	电气电子产品检验，盐雾测试实验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电气电子产品检验，盐雾测试实验

半导体分立器件静态参数测试系统

半导体分立器件静态参数测试系统天光测控DCT1401能测试很多电子元器件的静态直流参数（如击穿电压 $V(BR)CES/V(BR)DSs$ 、漏电流 $ICES/IGEs/IGSs/IDSs$ 、阈值电压 $VGE(th)$ 、开启电压 $VCE(on)$ 、跨导 Gfe/Gfs 、压降 Vf 、导通内阻 $Rds(on)$ ）。

测试种类覆盖7大类别26分类，包括“二极管类”“三极管类（如BJT、MOSFET、IGBT）”“保护类器件”“稳压集成类”“继电器类”“光耦类”“传感监测类”等品类的繁多的电子元器件。

高压源标配1400V（选配2KV），高流源标配100A（选配40A,200A）

控制极/栅极电压40V，栅极电流10mA

分辨率*高至1mV / 1nA，精度*高可至0.5%

DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统能够测试分立器件静态参数还可测试“结电容”，支持“脉冲式一键加热”和“分选机连接”

第一部分：规格&环境

1.1、产品信息

产品型号：DCT1401& 029@87309001

产品名称：半导体分立器件静态参数测试系统

1.2、物理规格

主机尺寸：深660*宽430*高210(mm)

主机重量：< 35kg

主机颜色：白色系

1.3、电气环境

主机功耗：< 300W

海拔高度：海拔不超过 4000m；

环境要求：-20 ~ 60（储存）、5 ~ 50（工作）；

相对湿度：20%RH ~ 75%RH (无凝露，湿球温度计温度 45 以下)；

大气压力：86Kpa ~ 106Kpa；

防护条件：无较大灰尘，腐蚀或爆炸性气体，导电粉尘等；

电网要求：AC220V、 $\pm 10\%$ 、50Hz ± 1 Hz；

工作时间：连续；

第二部分：应用场景和产品特点（DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统）

一、应用场景

- 1、测试分析（功率器件研发设计阶段的初始测试）
- 2、失效分析（对失效器件进行测试分析，查找失效机理。以便于对电子整机的整体设计和使用过程提出改善方案）
- 3、选型配对（在器件焊接至电路板之前进行全部测试，将测试数据比较一致的器件进行分类配对）
- 4、来料检验（研究所及电子厂的质量部（IQC）对入厂器件进行抽检/全检，把控器件的良品率）
- 5、量产测试（可连接机械手、扫码枪、分选机等各类辅助机械设备，实现规模化、自动化测试）
- 6、替代进口（西安天光测控DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统）

二、产品特点

- 1、程控高压源10~1400V，提供2000V选配；
- 2、程控高流源1uA~100A，提供40A,200A选配；
- 3、驱动电压10mV~40V
- 4、控制极电流10uA~10mA；
- 5、16位ADC，100K/S采样速率；
- 6、自动识别器件极性 NPN/PNP
- 7、四线开尔文连接保证加载测量的准确
- 8、通过 RS232 接口连接校准数字表，对系统进行校验
- 9、不同的封装形式提供对应的夹具和适配器（如TO220、SOP-8、DIP、SOT-23等等）
- 10、半导体分立器件静态参数测试系统能测很多电子元器件（如二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可

控硅、光耦、继电器等等)；

11、西安天光测控DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统能测试静态直流参数(如击穿电压 $V_{(BR)CES}$ / $V_{(BR)DSs}$ 、漏电流 I_{CES} / I_{GES} / I_{GSs} / I_{DSs} 、阈值电压/ $V_{GE(th)}$ 、开启电压/ $V_{CE(on)}$ 、跨导/ G_{fe} / G_{fs} 、压降/ V_f 、导通内阻 $R_{ds(on)}$)

12、结电容参数也可以测试，诸如 C_{ka} ， C_{iss} ， C_{rss} ， C_{oss} ；

13、脉冲电流自动加热功能，方便高温测试，无需外挂升温装置；

14、Prober 接口、Handler 接口可选(16Bin)，连接分选机*高效率1h/9000个；

15、西安天光测控DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统在各大电子厂的IQC、实验室有着广泛的应用；

第三部分：产品介绍(DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统)